1/9/1 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007451447 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1988-085381/\*198813\*

XRPX Acc No: N88-064453

Contactless thickness measurement device e.g. for foils, thin coatings - uses stimulation with thermal radiation and detection of stimulated thermal radiation

Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI )

Inventor: BAUMANN J; BEYFUSS M; PAPE H; TILGNER R Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week DE 3631652 19880324 Α DE 3631652 Α 19860917 198813 DE 3631652 C2 19940519 DE 3631652 19860917

Priority Applications (No Type Date): DE 3631652 A 19860917

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

DE 3631652 A 5

DE 3631652 C2 5 G01B-015/02

Abstract (Basic): DE 3631652 A

A heating arrangement (He) produces an intensity modulated thermal radiation (Hs) directed towards the measurement object (Mo). A radiation receiver (Se) detects the thermal radiation (St) emitted by the stimulated measurement object. The radiation receiver is limited to a region of receiption outside the wavelength or wavelength range of the stimulating thermal radiation.

The range of reception 3 limited by a filter (F1) which does not transmit the wavelength or wavelength range of the thermal radiation. Radiation outside the filter's transmission region is not absorbed but is reflected by it. The receiver is an infrared detector.

ADVANTAGE - Non-destructive measurement with high accuracy. 1/2

Title Terms: CONTACT; THICK; MEASURE; DEVICE; FOIL; THIN; COATING; STIMULATING; THERMAL; RADIATE; DETECT; STIMULATING; THERMAL; RADIATE Derwent Class: S02

International Patent Class (Main): G01B-015/02

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): S02-A05A

19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND** 

- **® Offenlegungsschrift**
- <sub>(1)</sub> DE 3631652 A1

(5) Int. Cl. 4: G01B15/02



**DEUTSCHES PATENTAMT** 

(71) Anmelder:

(21) Aktenzeichen:

Offenlegungstag:

P 36 31 652.0 17. 9.86 Anmeldetag: 24, 3,89

@ Erfinder:

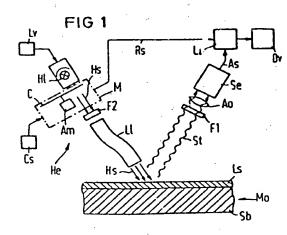
Tilgner, Rainer, Dipl.-Phys. Dr., 8000 München, DE; Baumann, Joachim, Dipl.-Phys. Dr., 8046 Garching, DE; Beyfuß, Martin, Dipl.-Phys.; Pape, Heinz, Dipl.-Phys., 8000 München, DE

Meßanordnung zur berührungslosen Dickenbestimmung

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

Zur zerstörungsfreien, berührungslosen Bestimmung der Dicke von Folien und Oberflächenbeschichtungen wird mit einer Heizeinrichtung (He) eine zeitlich intensitätsmodulierte Heizstrahlung (Hs) auf das Moßobjekt (Mo) gerichtet, während ein Strahlungsempfänger (Se) die vom Meßobjokt (Mo) emittierte thermische Strahlung (St) erfaßt und die jeweilige Dicke in einer nachgeordneten Signalauswertung ermittelt wird. Die Genauigkeit der Messungen wird dadurch erheblich gesteigert, daß der Strahlungsempfänger (Se), insbesondere du ch ein vorgeschaltetes Filter (FI), auf einen von der anregenden Heizstrahlung (Hs) separaten Empfangsbereich begrenzt wird. In der Heizeinrichtung (He) wird vorzugsweise ein Temperaturstrahler, insbesondere eine Halogenlampe (Hi), mit einem nachgeordneten Lichtleiter (LI), insbesondere einen Flüssigkeitslichtleiter, für die Erzeugung und Übertragung der Heizstrahlung (Hs) eingesetzt.

Flissighits lidt leiter



## Patentansprüche

1. McBanordnung zur zerstörungsfreien, berührungslosen Bestimmung der Dicke von Folien und dünnen Oberflächenbeschichtungen mittels instationärer Wärmeleitung, mit

 einer Heizeinrichtung (He) zur Erzeugung einer auf das McBobjekt (Mo) gerichteten zeitlich intensitätsmodulierten Heizstrahlung (Hs) 10

- einem Strahlungsempfänger (Se) für die vom angeregten Meßobjekt (Mo) emittierte thermische Strahlung (St),

dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlungsempfänger (Se) auf einen außerhalb der Wellenlänge (WI) oder des Wellenlängenbereichs (WIb) der onregenden Heizstrahlung (Hs) liegenden Empfangsbereich (Eb) begrenzt ist.

2. MeBanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dem Strahlungsempfänger (Se) zur Begrenzung des Empfangsbereichs (Eb) ein für die Wellenlänge (Wi) oder den Wellenlängenbedurchlässiges Filter (F 1) vorgeschaltet ist.

3. Meßanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Filter (F 1) Strahlung außerhalb des Durchlaßbereichs nicht absorbiert.

4. Meßanordnung nach Anspruch 3, dadurch ge- 30 kennzeichnet, daß das Filter (F 1) Strahlung außerhalb des Durchlaßbereichs reflektiert.

5. Meßanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Filter (F1) auf der vom Strahlungsempfänger (Se) abgewandten Seite eine 35 dielektrische Vielfachbeschichtung trägt.

6. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem Strahlungsempfänger (Se) eine Abbildungsoptik (Ao) vorgeschaltet ist.

7. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlungsempfänger (Se) als Infrarot-Detektor ausgebildet ist.

8. Meßanordnung nach einem der vorhergehenden 45 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung (He) einen Temperaturstrahler umfaßt. 9. Meßanerdnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperaturstrahler als Glühlampe ausgebildet ist.

10. MeBanordnung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperaturstrahler als Halogenlampe (HI) ausgebildet ist.

11. MeBanordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß dem Temperatur- 55 strahler ein für Wellenlängen im Empfangsbereich (Eb) des Strahlungsempfängers (Se) undurchlässiges Filter (F2) nachgeordnet ist.

12. MeBanordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizstrahlung 60 (Hs) über einen Lichtleiter (LI) auf das Meßobjekt (Mo) übertragbar ist.

13. Meßanordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtleiter (LI) als Flüssigkeitslichtleit rausgebildet ist.

14. MeBanordnung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtleiter (LI) für Wellenlängen im Empfangsbereich (Eb) des Strahlungsempfängers (Se) undurchlässig ist.

15. Meßanordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die anregende Heizstrahlung (Hs) auf Wellenlängen im Sichtbaren, im nahen Ultraviolett und im nahen Infrarot begrenzt ist.

16. MeBanordnung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizstrahlung (Hs) auf Wellenlängen zwischen 0,2 und 2 µm begrenzt ist.

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Meßanordnung zur zerstörungsfreien, berührungslosen Bestimmung der Dicke von Folien und dünnen Oberflächenbeschichtungen mittels instationärer Wärmeleitung, mit

einer Heizeinrichtung zur Erzeugung einer auf das Meßobjekt gerichteten zeitlich intensitätsmodulierten Heizstrahlung und

- einem Strahlungsempfänger für die vom angeregten Meßobiekt emittierte thermische Strahlung.

Das Prinzip der Dickenbestimmung von Folien und reich (Wlb) der anregenden Heizstrahlung (Hs) un- 25 dunnen Oberflächenbeschichtungen mit Hilfe der instationären Wärmeleitung ist seit langem bekannt. Es beruht darauf, bei einer zeitlich veränderlichen Aufheizung einer Probenoberfläche den daraus resultierenden zeitlichen Verlauf der Oberflächentemperatur auszuwerten. Es läßt sich zeigen, daß der zeitliche Verlauf der Temperatur nach einer zeitlich definierten Aufheizung empfindlich von der Dicke sowie von den thermischen Kenngrößen einer Schicht oder Folie abhängt. Im Prinzip kann die Aufheizung dabei einen zeitlichen Verlauf haben, der zwischen einem Einzelpuls und einer periodischen sinusförmigen Form liegt. Ist die Anregung periodisch, so stellt sich die Temperaturoszillation hinsichtlich Amplitude und Phase in charakteristischer Weise ein.

Eine Meßanordnung der eingangs genannten Art ist beispielsweise aus Z. Werkstofftech. 15, 140 – 148 (1984) bekannt. Bei der dort dargestellten Versuchsanordnung wird die von einem Laser erzeugte und in einem nachgeordneten Modulator in der Intensität periodisch veränderte Heizstrahlung auf das Meßobjekt gerichtet. Die absorbierte Heizstrahlung erzeugt dann sog. Wärmewellen, die von Grenzflächen im Probeninneren reflektiert werden. Diese reflektierten Wärmew llen werden dann an der Oberfläche des Meßobjekts über die resultierende Modulation der thermischen Emission nachg wiesen. Hierzu wird ein Infrarot-Detektor verwendet, dessen Ausgangssignal in einem phasenempfindlichen Lock-In Verstärker mit dem Referenzsignal des Modulators verglichen wird. Der derart ermittelte Phasenunterschied gibt dann Aufschluß über die jeweilige Schichtdicke, wobei durch einen Schiebeschlitten auch eine lokale Ortsauflösung ermöglicht wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine für den praktischen Einsatz geeignete Meßanordnung zur zerstörungsfreien, berührungslosen Bestimmung der Dicke von Folien und dünnen Oberflächenbeschichtungen mittels instationärer Wärmeleitung zu schaffen, die bei geringem baulichen Aufwand eine Dickenbestimmung hoher Genauigkeit ermöglicht.

Diese Aufgabe wird bei iner Meßanordnung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Strahlungsempfänger auf einen außerhalb der Wellenlänge oder des Wellenlängenbereichs der anregenden Heizstrahlung liegenden Empfangsbereich begrenzt ist.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß für Dickenbestimmungen hoher Genauigkeit eine Separation von Anregungs- und Nachweisstrahlung unerläßlich ist. Dementsprechend muß der Empfangsbereich des Strahlungsempfängers derart begrenzt werden, daß Strahlung mit der Wellenlänge oder im Wellenlängenbereich der anregenden Heizstrahlung nicht die Messung der emittierten thermischen Strahlung verfälschen 10 kann.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist dem Strahlungsempfänger zur Begrenzung des Empfangsbereichs ein für die Wellenlänge oder den Wellenlängenbereich der anregenden Heizstrahlung 15 undurchlässiges Filter vorgeschaltet. Mit Hilfe eines derartigen Filters kann die Begrenzung des Empfangsbereichs auf besonders einfache Weise realisiert werden. Vorzugsweise ist das Filter dann so ausgebildet, daß Strahlung außerhalb des Durchlaßbereichs nicht 20 absorbiert wird. Würde an der Oberfläche des Meßobjekts direkt reflektierte Strahlung in dem Filter absorbiert, so könnten durch diesen Absorptionsprozeß neue zeitkohärente und daher störende Infrarot-Quellen entstehen.

Die unerwünschte Absorption der Heizstrahiung wird vorzugsweise dadurch verhindert, daß das Filter Strahlung außerhalb des Durchlaßbereichs reslektiert. Diese Reflexion kann dann auf einfache Weise dadurch erzielt werden, daß das Filter auf der vom Strahlungs- 30 empfänger abgewandten Seite eine dielektrische Vielfachbeschichtung trägt.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist dem Strahlungsempfänger eine Abbildungsoptik vorgeschaltet. Eine derartige Abbildungsoptik, bei wel- 35 cher es sich um eine Infrarot-Sammellinse oder eine Spiegeloptik handeln kann, fokussiert dann die emittierte thermische Strahlung derart in den Strahlungsempfänger, daß die Temperatur eines definierten Bereichs der Obertläche des Meßobjekts erfaßt werden kann.

Vorzugsweise ist der Strahlungsempfänger als Infrarot-Detektor ausgebildet. Dabei haben pyroelektrische Infrarot-Detektoren den Vorteil, daß sie robust und billig sind und keine Kühlung benötigen. Entsprechende bessere Nachweisempfindlichkeit.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung umfaßt die Heizeinrichtung einen Temperaturstrahler, der gegenüber den bisher verwendeten fordert.

Ist der Temperaturstrahler als Glühlampe, insbesondere als Halogenlampe ausgebildet, so kann für die Erzeugung der Anregungsstrahlung auf die weit verbreiteten elektrischen Lichtquellen zurückgegriffen werden.

Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, wenn dem Temperaturstrahler ein für Wellenlängen im Empfangsbereich des Strahlungsempfängers undurchlässiges Filter nachgeordnet ist. Ein derartiges Filter sorgt dann dafür, daß die anregende Heizstrahlung keinen Anteil 60 im Empfangsbereich des Strahlungsempfängers hat.

Während die bisher verwendeten Laser auch aus grö-Berer Entfernung eine definierte und ausreichend intensive Energiezufuhr gewährleist n, sollte bei dem Einsatz von Lasern für eine geeignete Strahlenbündelung gesorgt w rden. Besonders günstig ist es dann, wenn die Heizstrahlung über einen Lichtleiter auf das Meßobjekt übertragbar ist. Mit Hille eines derartigen Lichtleiters

können dann auch Abstände im Meter-Bereich ohne nennenswerte Verluste überbrückt werden.

Besonders vorteilhaft ist es dann, wenn der Lichtleiter als Flüssigkeitslichtleiter ausgebildet ist. Derartige Flüssigkeitslichtleiter werden beispielsweise in Verbindung mit entsprechenden Glühlampen mit Erfolg für endoskopische Zwecke eingesetzt.

Weiterhin ist es auch besonders günstig, wenn der Lichtleiter für Wellenlängen im Empfangsbereich des Strahlungsempfängers undurchlässig ist. In diesem Fall kann dann ggf. ein separates, für Wellenlängen im Empfangsbereich des Strahlungsempfängers undurchiässiges Filter entfallen.

Im Hinblick auf die erforderliche Separation von Anregungs- und Nachweisstrahlung ist es schließlich auch noch zweckmäßig, wenn die anregende Heizstrahlung auf Wellenlängen im Sichtbaren, im nahen Ultraviolett und im nahen Infrarot begrenzt ist. Dabei hat sich eine Begrenzung auf Wellenlängen zwischen 0,2 und 2 µm als besonders vorteilhaft erwiesen, da Heizstrahlung in diesem Wellenlängenbereich vom Meßobjekt größtenteils absorbiert und kaum reflektiert wird.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher be-

25 schrieben.

Es zeigen in stark vereinfachter schematischer Darstellung:

Fig. 1 eine Meßanordnung zur berührungslosen Bestimmung der Dicke von Folien und Oberflächenbeschichtungen und

Fig. 2 die Separation von Anregungs- und Nachweisstrahlung.

Mit der in Fig. 1 dargestellten Meßanordnung soll an einem mit Mo bezeichneten Meßobjekt die Dicke einer auf Stahlblech Sb aufgebrachten Lackschicht Ls ermittelt werden. Hierzu wird zunächst die mit einer Heizeinrichtung He erzeugte, intensitätsmodulierte Heizstrahlung Hs auf die Oberfläche der Lackschicht Ls gerichtet. Für die Erzeugung der intensitätsmodulierten Heizstrahlung Hs sind eine an eine regelbare Lampenversorgung Lv angeschlossene Halogenlampe HI und ein nachgeordneter Modulator M vorgesehen. Der Modulator M umsaßt einen durch einen Antriebsmot r Am angetriebenen Lichtzerhacker oder Chopper Cund eine Halbleiterdetektoren ermöglichen demgegenüber eine 45 mit Cs bezeichnete Choppersteuerung. Nach dem Modulator M wird dann die intensitätsmodulierte Heizstrahlung Hs über ein Filter F2 und einen flexiblen Lichtleiter Llauf die Lackschicht Ls gerichtet.

Die in der Lackschicht Ls absorbierte Heizstrahlung Lasern einen erheblich geringeren Kostenauswand er- 50 Hs bewirkt an der Oberstäche eine Temperaturoszillation, die über die entsprechend emittierte thermische Strahlung St von einem Strahlungsempfänger Se erfaßt wird. Die emittierte thermische Strahlung St gelangt dabei über ein Filter F1 zu einer als Infrarot-Sammel-55 linse ausgebildeten Abbildungsoptik Ao, welche die thermische Strahlung St so in den Strahlungsempfänger Se fokussiert, daß jeweils nur die Temperatur eines definierten Bereichs der Oberfläche der Lackschicht Ls erfaßt wird.

Die Signalverarbeitung umfaßt einen Lock-In Verstärker LI und ein mit Dv bezeichnetes Digitalvoltmeter. Der Lock-In Verstärker LI ermittelt dabei den Phasenunterschied zwischen dem Referenzsignal Rs des Modulators M und dem Ausgangssignal As des Strahlungsempfängers Se. Das dem Lock-In Verstärker LI nachgeordnete Digitalvoltmeter Dy kann dann so geeicht werden, daß es die jeweilige Dicke der Lackschicht Ls anzeigt.

Bei der in Fig. 1 dargestellten McBanordnung soll cine Separation von Anregungs- und Nachweisstrahlung bewirkt werden, die im folgenden unter zusätzlichem Hinweis auf Fig. 2 crläutert wird. Dort sind auf einer horizontalen Achse Wellenlängen  $\lambda$  in  $\mu$ m aufgetragen, die im nahen Ultraviolett UV, im Sichtbaren S und im Infrarot IR liegen. Mit Bezug auf diese Achse ist ferner zu erkennen, daß die Halogenlampe HI eine Heizstrahlung Hs mit Anteilen im nahen Ultraviolett UV, im Sichtbaren S und im nahen Infrarot IR aussendet. Der 10 Bereich der Wellenlänge & der von der Halogenlampe HI ausgesandten Heizstrahlung Hs liegt im dargestellten Ausführungsbeispiel ungefähr zwischen 0,25 und 2,5 um. Das Filter F1 oder - wie dargestellt - der als Flüssigkeitslichtleiter ausgebildete Lichtleiter LI lassen 15 von dieser Heizstrahlung Hs nur Wellenlängen  $\lambda$  im Sichtbaren S und im nahen Infrarot Ir durch, wobei dieser Bereich den Wellenlängenbereich WIb der auf das Meßobjekt Mo einfallenden Heizstrahlung Hs entspricht. Im darge tellten Ausführungsbeispiel ist der 20 Wellenlängenbereich Wlb auf Wellenlängen 2 zwischen 0,25 und 0,75 µm begrenzt, da die im Lichtleiter LI verwendete Flüssigkeit nur in diesem Wellenlängenbereich transparent ist.

Der als Strahlungsempfänger Se verwendete Infrarot-Detektor würde ohne das vorgeschaltete Filter F1
auch auf Strahlung im Wellenlängenbereich Wlb ansprechen. Damit der Strahlungsempfänger Se mit Sicherheit nur die vom Meßobjekt Mo emittierte thermische Strahlung St erfaßt, wird das Filter F1 so ausgelegt, daß es nur für Strahlung St durchlässig ist, deren
Wellenlängen  $\lambda$  oberhalb des Wellenlängenbereichs
Wlb liegen. Der Durchlässigkeitsbereich des Filters F1
definiert den Empfangsbereich Eb des Strahlungsempfängers Se. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das
Filter F1 durch eine dielektrische Vielfachbeschichtung
so ausgelegt, daß es nur für thermische Strahlung St mit
Wellenlängen  $\lambda$  oberhalb 1.0 µm durchlässig ist und
Wellenlängen  $\lambda$  von weniger als 1 µm reflektiert.

Die ersindungsgemäße Separation von Anregungs- 40 und Nachweisstrahlung ist in Fig. 2 dadurch zu erkennen, daß sich der Wellenlängenbereich WIb der anregenden Heizstrahlung Hs und der eingeschränkte Empfangsbereich Eb des Strahlungsempfängers Se deutlich unterscheiden. Der dazwischenliegende Differenzbe- 45 reich  $\Delta \lambda$  der Wellenlänge  $\lambda$  kann als Sicherheitszone angesehen werden, durch welche Überschneidungen auch bei geringfügigen Änderungen der jeweiligen Durchlaßbereiche ausgeschlossen werden. Derartige Änderungen sind beispielsweise darauf zurückzuführen. 50 daß es sich bei dem Filter F1 um ein Interferenzfilter handelt, dessen Durchlaßbereich sich mit dem Einfallsbereich der Heizstrahlung Hs ändern kann. Dementsprechend kann auch ggf. eine Beeinflussung des Strahlungsempfängers Se durch eine "Rest-Streustrahlung" 55 durch geeignete Plazierung des Filters F1 weiter reduziert oder ausgeschlossen werden.

Mit der vorstehend beschriebenen Meßanordnung können Dickenbestimmungen von Folien und Beschichtungen durchgeführt werden, sofern das Meßobjekt von 60 wenigstens einer Seite her zugänglich ist. Die zerstörungsfreie und berührungslose Dickenbestimmung ist insbesondere für Lackschichten oder Kunststoffbeschichtungen geeignet, die auf ein Trägermaterial mit von der Beschichtung verschiedenen thermischen Größen, insbesondere Metall, aufgebracht sind. Die Meßanordnung ist prinzipiell auch bei einem Arbeitsabstand im Meter-Bereich einsetzbar. Es können auch Oberslä-

chenbeschichtungen unmittelbar nach der Auftragung im noch unverfestigten Zustand vermessen werden. Mit der Meßanordnung kann eine zuverlässige On-line-Überwachung und On-line-Regelung der Folien- 1-7-v. Beschichtungsdicke in der Fertigung durchgeführt werden.

Wird bei der in Fig. 1 dargestellten Meßanordnung in der Heizeinrichtung He anstelle der Halogenlampe Hl ein Laser eingesetzt, so ist die Wellenlänge  $\lambda$  der Heizstrahlung Hs auf die Emissionswellenlänge des jeweiligen Lasers begrenzt. In Fig. 2 ist dies für einen Argonlaser durch die Wellenlänge Wl angedeutet. Bei Verwendung eines Lasers können dann auch das Filter F2 und insbesondere der Lichtleiter Ll entfallen.

Die beschriebene Meßanordnung wurde für die Dikkenbestimmung von Lackschichten Ls aus noch unverfestigtem grauen Aoryllack auf 0,5 mm dicken Stahlblech Sb eingesetzt. Bei einer Frequenz des Modulators von 13 Hz zeigte das entsprechend geeichte Digitalvoltmeter Dv beispielsweise einen Phasenunterschied von 120° an, was einer Dicke der Lackschicht von 55 μm entsprach.

Fig. : 113 1:121 23 31 C52 Nummer: Int. Cl.4: G 01 B 15/82 Anmeldetag: 17. Sopt mbor 15 Offenlegungstag: 24. Mõrz 1808 1/1 25 P 16 16 DE 3631652 FIG 1 Rs Ao FIG 2 -Wlb **3**→Δλ-Ε 0,4 0,75 1,0 2,0 UV-1- S --- IR